

[안내] 구미전자정보기술원 저활용 연구시설장비 이전 신청

○ 연구시설장비 이전 절차

단계 (예상 일정)	주요 내용	수행 주체
장비이전 신청 (2024년 4월~)	· ZEUS 나눔터 이전 신청(www.zeus.go.kr) · 기술원 방문 및 장비상태 확인	양수기관
장비이전심의위원회 (매달)	· 장비이전 타당성 검토 · 이전기관 및 이전지원금액 결정	ZEUS
장비이전 (심의가결 후)	· 장비이전(양수기관) 및 공고 종료(GERI)	양수기관
이전장비 사후관리 (계속)	· 이전완료 후, 장비활용실적 조사	양수기관

○ 간략한 이전 순서

- ① 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr) 나눔터 장비조회(양수기관)
- ② 구미전자정보기술원 방문 및 장비상태 직접 확인(양수기관)
- ③ ZEUS 장비활용종합포털에서 해당 장비 이전 신청(양수기관)
- ④ 이전타당성 검토 및 지원금액 결정(ZEUS)
- ⑤ 장비이전 및 사후관리(양수기관)

○ 문의 : ZEUS(1670-0925), GERI(054-479-2177, jhj7@geri.re.kr)

○ 붙임

1. 구미전자정보기술원 이전공고 예정 연구시설장비 목록 1부
2. 구미전자정보기술원 이전 연구시설장비 목록 1부

붙임. 구미전자정보기술원 이전공고 예정 연구시설장비 목록총 27대

※ ZEUS 나눔터 공고 예정

구분	연구시설·장비명 (모델명)	구축연도	장비용도	장비상태 등급
1	라만분광계 (Invia)	2007.05.	라만 산란(Ramanscattering)을 이용하여 탄소 소재, 이차전지, 유/무기 화합물의 구조분석 및 결정성을 평가하는 장비	C
2	적외선 분광 현미경 (HYPERION)	2007.05.	50um 사이즈 이상의 유기화합물 구조분석이 가능한 분석 장비	C
3	고저항터치패널용투명 전극제조장비 (RVS250)	2010.08.	롤 상태의 필름에 스퍼터링 방식으로 연속 증착하는 시스템	C
4	두드림검사(신뢰성시스템) (HM-100)	2010.08.	일정 압력과 두드림 횟수를 통한 저항막방식 터치패널 전극의 내마모성을 테스트하는 장비	C
5	디스펜서(합지시스템) (MD-100)	2010.08.	7인치 이하 저항막방식 터치패널용 전극 디스펜싱을 위한 장비	C
6	라미네이터(합지시스템) (LA-100)	2010.08.	롤필름의 보호필름 및 OCA 부착을 위한 라미네이터 장비	C
7	셀라미네이터(합지시스템) (ML-100)	2010.08.	5인치 이하 터치패널 셀의 보호필름 및 OCA를 부착하는 장비	C
8	셀롤링합착장비 (시트가공시스템) (CELL-7)	2011.03.	7인치 이하 터치패널용 합지공정(G2G,G2F)을 위한 롤링합착기	C
9	스핀코팅시스템 (포토공정시스템) (NP003-500SA)	2012.03	터치패널 및 디스플레이 공정용 PR도포를 위한 스핀코팅장비	C
10	쓰기검사기(신뢰성시스템) (WM-100)	2010.08.	저항막 방식 터치센서의 반복쓰기시험으로 수명을 테스트하는 장비	C
11	특성검사장비 (신뢰성시스템) (ST-100)	2010.08.	저항막 방식의 터치센서의 선형성 검사를 위한 장비로 활용	C
12	고온고습 연속결합측정기 (-)	2014.02.	온도 및 습도 조건을 변화하며 PV Module 및 부품소재의 근적외선 이미지를 주기적으로 측정하여 모듈 및 부품의 온습도에 따른 결함 및 노화를 실시간으로 모니터링할 수 있는 장비	C
13	라이프타임 측정기 (WT-2000PVN)	2013.11.	u-PCD방식을 이용해 Sample의 minority carrier lifetime 측정할 수 있는 장비	C
14	염수분무시험기 (-)	2013.11.	염수분무 가혹 조건에서의 PV 모듈의 환경신뢰성 평가를 위한 장비	C
15	솔라셀 소터 (-)	2014.02.	Micro Crack 및 Color 검사를 한 후 불량 기준치 및 절대 효율등급에 의해 Auto Sorting하는 장비	C

16	전극인쇄 및 소성시스템 (-)	2013.12.	Loader, Printer, Dryer, Buffer, Firing furnace, Unloader가 인라인으로 구성되어 있으며 웨이퍼가 적재된 매거진을 웨이퍼 로더에 로딩하면 자동으로 정렬 프린팅 건조 소성 및 매거진에 자동으로 적재되어 공정이 마무리되는 인라인 시스템	C
17	전류-전압특성측정기 (Agilent 4155C MS-TECH Probe Station)	2006.12.	소재 및 부품의 전기적 특성 측정할 수 있는 장비	C
18	태양광 모의조사 시험장비 (DKSMT-1520L)	2013.11.	태양광 규격에 부합한 태양전지 모듈의 출력을 측정하여 각 모듈의 등급을 결정할 수 있는 측정 장비	C
19	카세트 변환장치-2 (-)	2014.01.	표면구조화 및 PSG계거 시스템, ARC 및 도핑증착시스템의 카세트에 샘플을 자동으로 로딩하는 장비	C
20	초순수제조장치 (Ultra Clear TWF UV TM)	2007.05.	이화학 분석장비 운영 및 전처리에 사용되는 초순수 제조	C
21	광학평가시스템 (GS-1290-NVIS-2)	2014.06.	3D 시칭 영역의 정확한 구분을 위해 정밀한 로봇 시스템을 이용한 휘도 및 색좌표의 평가	C
22	광학필름부착기 (LABA-1300)	2014.06.	필름과 필름 또는 필름과 유리기판을 가열판 사이에 넣고 열과 압력을 동시에 가하여 접착하는 공정장비	C
23	초기세정기 (APS-1350S)	2014.06.	3D 제품생산 중 초기 3D구현을 위한 코팅하기 전에 세제를 사용하여 Glass or Film을 초기 세정하는 설비	C
24	고도시험기 (EAH-55-2-35-LAC-X)	2015.06.	부품 및 제품의 수송(포장유통), 저장, 운용 시 노출되는 기후환경인 고도(감압) 환경에 대한 내구성 평가를 위한 장비	C
25	유기디스플레이패널수명시스템 (M6000 MDX)	2016.06.	기후환경(온습도) 및 패널 수명 평가 장비	C
26	유기전자소자수명시스템 (M6000 PMX)	2016.06.	기후환경(온습도) 및 전자소자 수명 평가 장비	C
27	워크인 패널 동작 신뢰성시스템 (PER-185EXHH)	2017.10.	대형 디스플레이 제품(대형TV, 모니터, 사이니지 등)의 저장 및 운용 시 노출되는 기후환경 온습도에 대한 내구성 평가를 위한 장비	C

※ 장비상태등급

- S : 현재 정상 사용중으로 이전 후 바로 사용가능
- A : 장비가액의 10% 이내에서 수리 후 정상 작동 확실
- B : 장비가액의 10% 초과 30% 이하로 수리 후 정상 작동 확실
- C : 수리 후 정상 작동 불확실, 부품재활용으로 활용가능

붙임2. 구미전자정보기술원 이전 연구시설장비 목록(총 46대)

※ ZEUS 나눔터 공고중

구분	연구시설·장비명 (모델명)	구축연도	장비용도	장비상태 등급
1	디지털방송전송기 (SFU)	2008.02.	디지털 방송과 관련한 모바일 TV 및 디지털 TV의 표준신호 발생기	S
2	무선랜분석기 (AiroPeek NX)	2006.03.	무선네트워크의 보안 장애원인분석 등 지원	S
3	USB프로토콜분석기 (AiroPeek NX)	2006.02.	새로운 USB 장비를 테스트할 경우 또는 이미 만들어진 USB 장비의 고장검사	S
4	습식세정장비 (MSC-08)	2008.03.	소자 공정시 샘플 세척 및 클리닝 공정 수행	B
5	전해연마기 (Electromet 4)	2007.03	금속재료의 표면 처리 용도	B
6	강박시험기 (-)	2013.12.	태양광 모듈이 옥외 설치 시 우박 등의 충격에 대한 기계적 강도를 확인하기 위한 목적의 시험장비	C
7	광스펙트럼분석기 (OPI-100M)	2007.02.	LED BLU 및 일반조명기구의 스펙트럼 분석	C
8	부품소재 온도특성 시험분석기 (-)	2012.11.	태양전지 모듈의 옥외시험장비	C
9	부품소재 자외선 내구 시험기 (-)	2013.04.	태양전지 모듈 및 부품소재에 대해 자외선에 대한 내구성을 평가하는 신뢰성 장비	C
10	부품소재 압력분포 시험기 (-)	2013.12.	태양전지 모듈의 외부압력 신뢰성시험용 장비	C
11	잉크젯 전극인쇄기 (Jetlab4)	2014.05.	미세 선폭이 요구되는 패턴을 형성하기 위한 장비	C
12	자기장측정시스템 (480 Fluxmeter)	2006.02.	임의 지점의 자기장의 세기를 측정. 자성체 또는 전자석 주변의 자기장의 세기를 측정	C
13	정선박스 시험기 (-)	2013.12.	태양전지 모듈 Bypass 시험장비	C
14	카세트 변환장치-1 (-)	2014.01.	표면구조화 및 PSG제거 시스템, ARC 및 도핑증착 시스템의 카세트에 샘플을 로딩하는 장비	C
15	태양전지 양자효율 측정기 (IQE-200)	2012.10.	태양전지 셀 광전변환 효율 측정	C
16	홀효과측정장비 (HMS-3000)	2007.09.	캐리어 이동도 농도 등 전기적 특성평가	C

17	낙하시험기 (AD125A)	2006.02.	포장/수송 등의 유통환경 시 발생할 수 있는 자유 낙하(충격) 환경 구현을 통해 부품 및 제품의 낙하(충격)에 대한 내구성을 평가하는 신뢰성 장비	C
18	염수분무시험기 (DCTC-1200P)	2007.03.	염수 환경구현을 통해 제품 및 부품의 내부식성(화학적 변화 포함)을 평가하는 기후환경 신뢰성 장비	C
19	온습도챔버-III (TEMI550)	2004.12.	부품 및 제품의 기후환경(온도, 습도, 사이클 시험 등) 구현을 통해 기후환경에 대한 내구성을 (가속수명시험, 고장메커니즘 분석 등) 평가하는 신뢰성 장비	C
20	저진공주사전자현미경 (Quanta 400)	2008.04.	전자현미경을 이용하여 저진공상태에서 표면 형상 분석/성분분석 하는 장비	C
21	피로시험기 (858)	2007.06.	인장 압축 반복시험을 통한 피로 테스트장비	C
22	비커스경도시험기 (HV-115)	2007.05.	비커스 압입자를 통한 경도 측정기	C
23	SAR측정시스템 (-)	2007.12.	전자기기에서 발생하는 전자파의 인체흡수율 (SAR: Specific Absorption Rate) 시험 장비	C
24	SAR측정로봇 (DASY5)	2007.11.	SAR측정시스템의 보조장비로 전자파의 인체 흡수율 (SAR: Specific Absorption Rate) 시험 시 활용됨	C
25	RSE측정시스템 (-)	2007.12.	단말기에서 발생하는 불필요한 성분의 주파수를 측정하고 규격치 이상으로 발생되지 않도록 측정 교정하는 장비	C
26	RSE챔버 (ETSI EN 300-328)	2007.09.	RSE측정시스템의 보조장비로, 챔버실 내 단말기를 거치하여 불필요한 성분의 주파수를 측정하고 규격치 이상으로 발생되지 않도록 측정 시 활용됨	C
27	임의파형발생기 (AFG3101)	2008.03.	사인, 사각, 삼각 및 사용자 정의 파형 발생장비	C
28	RF신호발생기 (MG3700A)	2006.02.	다양한 통신 방식의 디지털 변조 신호를 지원하는 신호 발생기	C
29	휘도계 (CS-1000A)	2004.12.	디스플레이 휘도 색도 색온도 등을 측정	C
30	접촉각측정기 (DM 700)	2007.02.	디스플레이 반도체 전자재료 코팅재 등의 표면장력을 측정	C
31	전자식별테스트시스템 (NI PXI-1044)	2008.03	Reader & Tag 초기개발 및 성능향상 수행하는 R&D 통신 프로토콜 분석, 범용 방사파 등 성능분석	C
32	열중량분석기 (SDT Q600)	2005.01.	시료를 승온 냉각 등은 변화시켰을 때 시료가 흡수/방출한 에너지(열) 무게 변화를 측정하는 기기	C
33	페이스트액성 특성평가장치 (-)	2005.01.	Paste 특성분석	C
34	나노인덴테이션 (G200)	2008.06.	재료의 경도 및 탄성계수 측정	C

35	E-Beam 증착장비 (Karon-1B-1500)	2007.10.	이온빔을 이용한 산화물 및 금속 전극 형성을 위한 박막증착장비 용도로 사용	C
36	콤파 코터 (STC-28AC)	2008.01.	페이스트소재의 성능평가를 위해 닥터블레이드 방식의 후막형성 공정장비로 사용	C
37	고정밀반자동인쇄기 (sp-1515 VSP)	2006.01.	터치스크린 패널제작	C
38	임프린트장비 (imprint-1)	2009.01.	마스터 몰드를 이용하여 임프린팅 방식을 통해 유전체등의 다양한 패턴을 형성 공정장비로 사용	C
39	레이저패턴장비 (MACH 600)	2010.08.	PET Film과 Glass 위에 코팅된 박막을 UV 레이저로 건식 식각 하는 설비	C
40	정전기방전시험기 (NSG 438)	2007.04.	임의로 정전기를 발생시켜 시험 대상품의 정전기에 대한 내성 정도를 확인 하는 장비	C
41	서지및버스트시험기 (Modula 6150)	2007.04.	서지 및 버스트 등에 대한 내성정도를 시험하는 장비	C
42	전압및자기장측정시스템 (Modula 6150)	2007.12.	전압 및 자기장 등에 대한 내성정도를 시험하는 장비	C
43	저장용 냉장고 (MPR-1013R)	2007.03.	시료 및 시약 보관기기	C
44	저장용 냉동고 (MDF-U442)	2007.03.	시료 및 시약 보관기기	C
45	OTA챔버 (MIL-STD-285)	2008.02.	OTA측정시스템의 보조장치로 차폐 챔버실 내 시험품 거치를 통해 안테나 특성 측정시 활용	C
46	후방산란전자회절분석기 (INCA Crystal)	2005.04.	국소부위 결정방위 및 결정구조를 분석하는 장비	C

※ 장비상태등급

- S : 현재 정상 사용중으로 이전 후 바로 사용가능
- A : 장비가액의 10% 이내에서 수리 후 정상 작동 확실
- B : 장비가액의 10% 초과 30% 이하로 수리 후 정상 작동 확실
- C : 수리 후 정상 작동 불확실, 부품재활용으로 활용가능